

Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełen serwis, kalibracja i ew. naprawa urządzenia do realizacji subtelnych, niskosumowych pomiarów elektrycznych – Keithley 4200 Semiconductor Characterization System. System ten pozwala na realizację pomiarów zależności wielkości elektrycznych struktur i przyrządów półprzewodnikowych z wysoką czułością (np.: pomiar prądu – rzędu kilku fA, pomiar pojemności – rzędu kilku fF), w bardzo szerokim zakresie częstotliwości (od polaryzacji stałej do sygnałów rzędu 30 MHz). System wyposażony jest w moduły pomiarowe umożliwiające ultraszybkie pomiary impulsowe, np. metodą charge-pumping, split-CV czy stress-and-sense oraz moduły w istotny sposób rozszerzające możliwości pomiarowe systemu, np. ultraszybkie zdalne przełączniki 4225-RPM umożliwiające realizację pomiarów kombinowanych I-V, C-V oraz impulsowych.

Usługa dotyczy realizacji pełnego serwisu urządzenia, kalibracji i sprawdzenia poprawności działania wszystkich zainstalowanych w systemie modułów oraz aktualizacji oprogramowania sterującego. Opisane czynności, z racji charakteru, stopnia złożoności oraz ceny urządzenia, mogą zostać przeprowadzone jedynie przez producenta sprzętu poprzez oficjalnych Dystrybutorów w Polsce.

Usługa obejmuje odebranie urządzenia z laboratorium Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75, 001-662 Warszawa) oraz dostarczenie go w to samo miejsce po wykonaniu usługi.